سیویلیکا - ناشر تخصصی مقالات کنفرانس ها و ژورنال ها
گواهی ثبت مقاله در سیویلیکا
CIVILICA.com

عنوان مقاله:
استفاده از تکنیک میکرو EDXRF جهت تعیین ضخامت لایه های طلا و نقره در فیلمهای دو لایه طلا/نقره

محل انتشار:
چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 6

نویسندگان:
محمد قربا ن پور - *اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی ومهندسی، گروه مهندسی شیمی (استادیار)*

کاووس فلامکی - *تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی (دانشیار)*

خلاصه مقاله:
فیلمهای دولایه طلا/نقره باضخامت کلی 50 nm در ساخت تراشه حسگرهای تشدید پلاسمون سطح کاربرد دارند. در حال حاضر روشی که قادر به آنالیز نسبت ضخامت لایه های طلا به نقره در فیلمهای دو لایه طلا/نقره باشد گزارش نشده است. بدین منظور، در این تحقیق روشی بر پایه تکنیک میکرو EDXRF ارائه شده است.

کلمات کلیدی:
تکنیک میکرو EDXRF ، ضخامت ، فیلمهای دو لایه طلا/نقره

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:
https://civilica.com/doc/228194